



Contribution ID: 130

Type: Poster

Development of a Frequency Comb for XUV Metrology of Highly Charged Ions

Keywords

frequency comb
laser spectroscopy
metrology
highly charged ions
high harmonic generation
enhancement cavity

Topics

Fundamental Aspects, Structure and Spectroscopy

Primary authors: Mr NAUTA, Janko (Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg); Mr OELMANN, Jan-Hendrik (Max-Planck-Institut für Kernphysik); Mr ACKERMANN, Alexander (Max-Planck-Institut für Kernphysik.); Mr STARK, Julian (Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg); Mr KÜHN, Steffen (Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg); MICKE, Peter (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany); Mr CRESPO LÓPEZ-URRUTIA, José R. (Max-Planck-Institut für Kernphysik); Prof. PFEIFER, Thomas (Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg)

Presenter: Mr NAUTA, Janko (Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg)